

## XRR 解析レポート

## プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

## 解析条件

波長(nm): 0.15403

点数: 1451

2 $\theta$ (°): 開始 = 0.200, 終了 = 6.000

ステップ = 0.004

オフセット = 0.000e+000

フィッティング手法: Nelder-Mead

データ間隔: 1点ごとにフィッティング

残差タイプ:  $\Delta(\text{Log})^2$ 

最大反復数: 500

許容誤差: 1.00e-015

装置関数: 擬Voigt関数

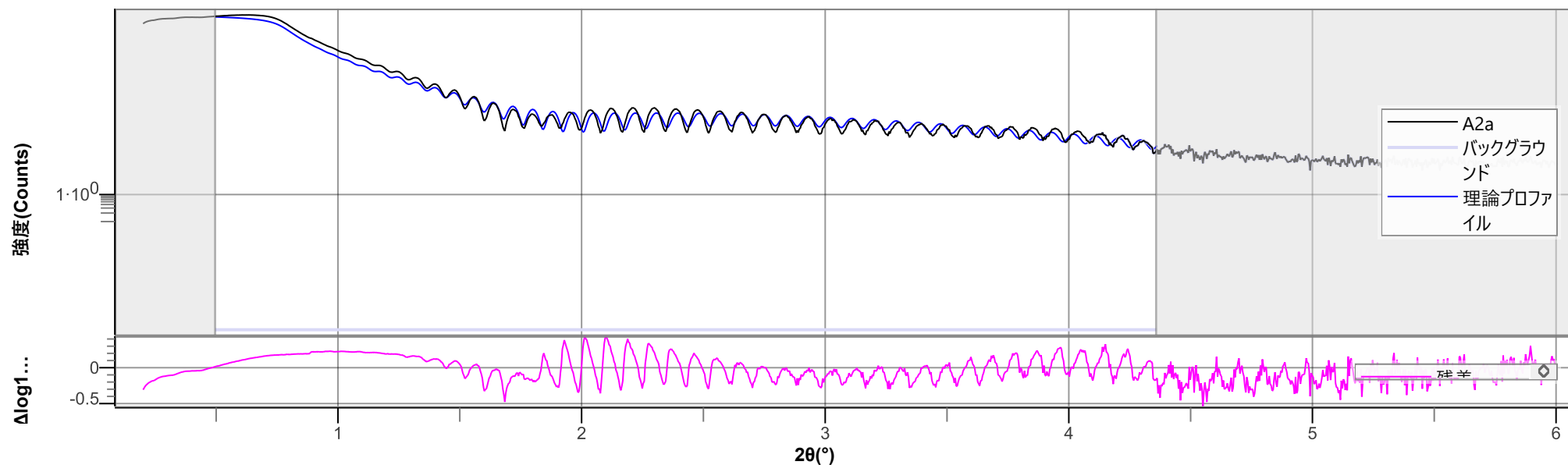
ローレンツ関数の比率: 0.00

ローレンツ幅: 1.00e-002

ガウス幅: 1.00e-002

## 結果

## プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)<th>	密度(g/cm³)<d>	粗さ(nm)<rg>	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L2	Fe2O3	2.575 ±0.2 Const 精密化	4.95000 Const	0.112 ±0.01 Con... 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	L1	Fe	92.599 ±0.04 Const 精密化	7.97400 Const	0.489 ±0.03 Con... 精密化	
	<input checked="" type="checkbox"/>	基板	Si	∞	2.32924 Const	0.500 Con...	